

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université YAHIA FARES
HALL TECHNOLOGIQUE



Presentation de service AFM



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

Identification de l'intéressé (e)

Nom & Prenom :

Fonction :

Établissement/Laboratoire:.....

Identification de l'échantillon

Dimension de l'identification: (....*....*....)mm

Type d`analyse : Couches minces

Bulk

Film

Autres

Nature des materiaux a analyser:

Metal

Semi-Conducteur

Isolant

Autres

Toxicologie du materiaux:

Toxique

Nocif

Irritant

Corrosif

Autres

Nombre des echantllons :

Type d'analyse

Topographie

Force laterale

Topographie_INV

Force laterale_INV

Autres

Cadre du travail de recherche

PFE

Magister

Doctorat Projet National

Cooperation

Directives pour l'analyse par microscope à force atomique (AFM)

Article I : Le microscope à force atomique est un instrument d'analyse très sensible et coût cher. A cet effet la manipulation et l'analyse est strictement réservée aux personelle responsable,

Article II : l'intéressé par les analyses AFM doit remplir et signer le présent formulaire et le disposer chez le directeur du Hall de technologie.

Article III : après avoir un avis favorable pour faire les analyses, l'intéressé doit déposer chez le responsable les échantillons qui respectent les conditions suivantes:

1- L'échantillon doit être solide.

2- Les dimensions limites de l`echantillon :
Min = (5*5*1) mm Max = (20*20*5)

3- Le matériaux a analyser ne doit pas être: Explosif, Toxique, Irritant ou Nocif.

4- Le nombre des échantillons ne dépasse pas dix (10) par ans.

Article IV : Le responsable de l`AFM et le seule manipulateur a cet appareil, il est strictement interdit a toute autre personne de toucher l'appareil.

Signature du bénéficiaire:

Ingénieur responsable de l'AFM	Directeur du Hall de Technologie

Médéa le :/...../.....